

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60404-11

1991

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
1998-07

Amendement 1

Matériaux magnétiques –

Partie 11:

Méthode d'essai pour la détermination

**de la résistance d'isolement superficiel des tôles
et feuillards magnétiques**

(standards.iteh.ai)

Amendment 1

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/42f77c51-22f5-45d0-af71-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/42f77c51-22f5-45d0-af71-c6723cac959e/iec-60404-11-1991-amd1-1998)

Magnetic materials –

Part 11:

Method of test for the determination

**of surface insulation resistance of magnetic
sheet and strip**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

D

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 68 de la CEI: Matériaux magnétiques tels qu'alliages et aciers.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
68/181/FDIS	68/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 6

2 Principe de mesure

Ajouter, à la page 8, à la fin du point a), la nouvelle phrase suivante:

Les deux forets hélicoïdaux assurent la fonction de contact avec le substrat pour le passage du courant.

Ajouter, à la page 8, à la fin du point b), après «courants d'électrodes individuels», le nouvel alinéa suivant:

Les deux forets hélicoïdaux assurent des fonctions différentes. Un foret fournit le contact avec le substrat pour le passage du courant. L'autre foret sert de détecteur de potentiel pour le contrôle de la tension de régulation. Cette méthode supprime l'influence d'une variation de la résistance de contact entre le foret de passage de courant et le substrat.

Remplacer, à la fin de l'avant-dernier alinéa, «la figure 2» par «les figures 2 et 3».

Page 8

3 Epreuve

Ajouter, à la fin du premier alinéa, la nouvelle phrase suivante:

Ce mesurage étant destructif, l'éprouvette ne peut être utilisée qu'une seule fois.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 68: Magnetic alloys and steels.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
68/181/FDIS	68/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 7

2 Principle of measurement

Add, on page 9, at the end of item a), the following new sentence:

The two twist drills perform the function of current return contacts with the substrate.

Add, on page 9, at the end of item b), after "individual electrode currents", the following new paragraph:

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/42f77c51-22f5-45d0-af71-c6723cac959e/iec-60404-11-1991-amd1-1998>

The two twist drills perform different functions. One drill provides the current return contact with the substrate. The other drill serves as a potential sensor for the voltage feedback control. This method removes the influence of the variable contact resistance between the current return drill and the substrate.

Replace, at the end of the penultimate paragraph, "figure 2" by "figures 2 and 3".

Page 9

3 Test specimen

Add, at the end of the first paragraph, the following new sentence:

This measurement is destructive; the test specimen can only be used once.

4.3 Mesure de courant

Remplacer le titre de ce paragraphe par le nouveau titre suivant:

Mesurage du courant

Remplacer le deuxième alinéa de ce paragraphe par ce qui suit:

Les dispositifs électriques du circuit de stabilisation et des systèmes de mesure du courant sont décrits aux figures 2 et 3 pour les modes A et B respectivement.

Remplacer la figure 2 par les deux figures suivantes:

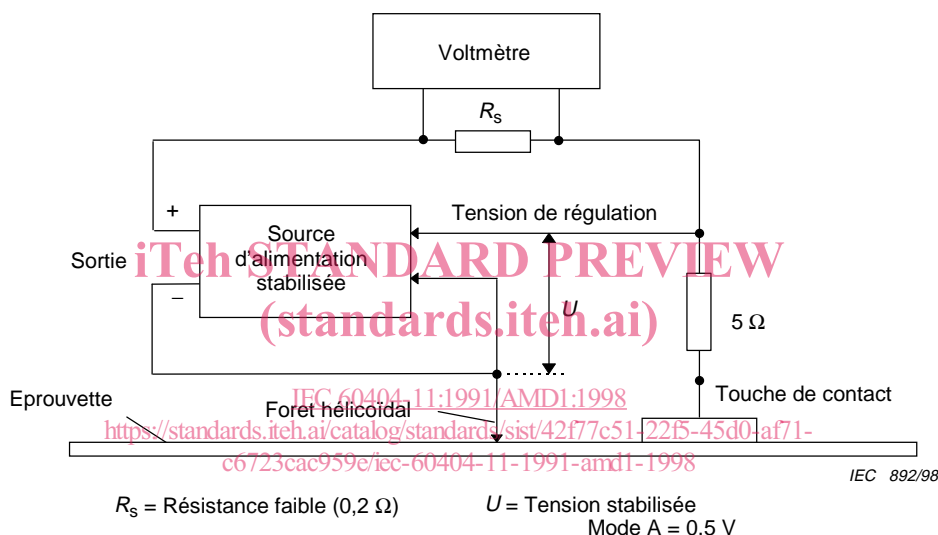


Figure 2 - Organisation du circuit de stabilisation: mode A

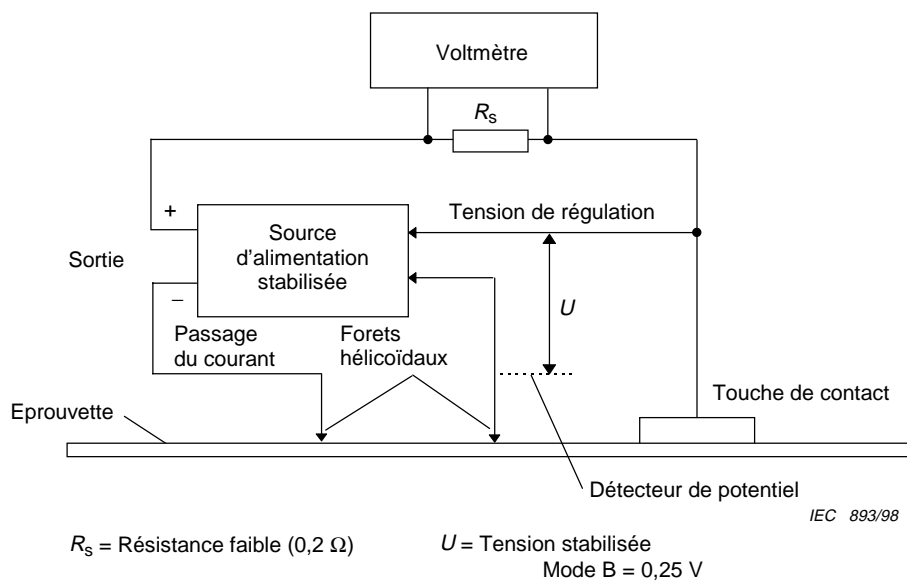


Figure 3 - Organisation du circuit de stabilisation: mode B

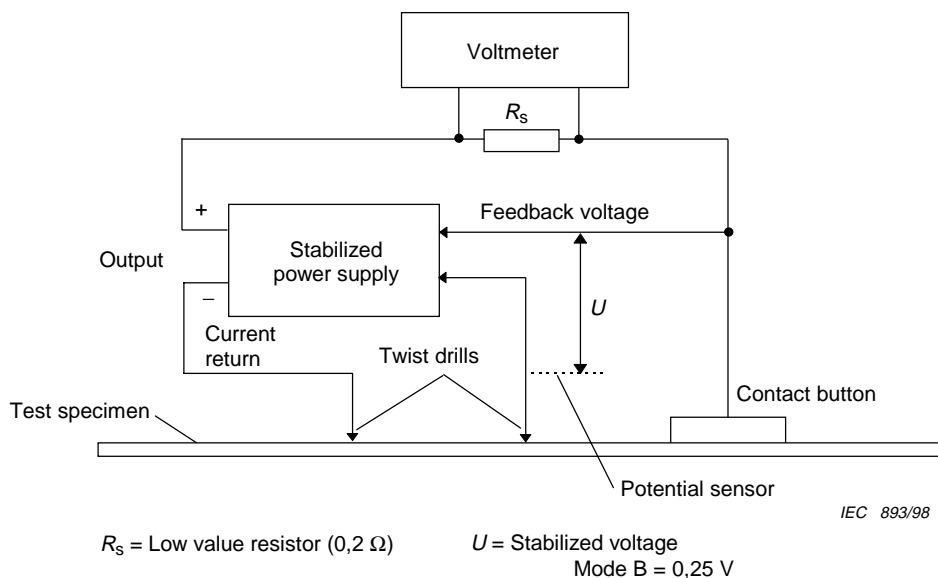
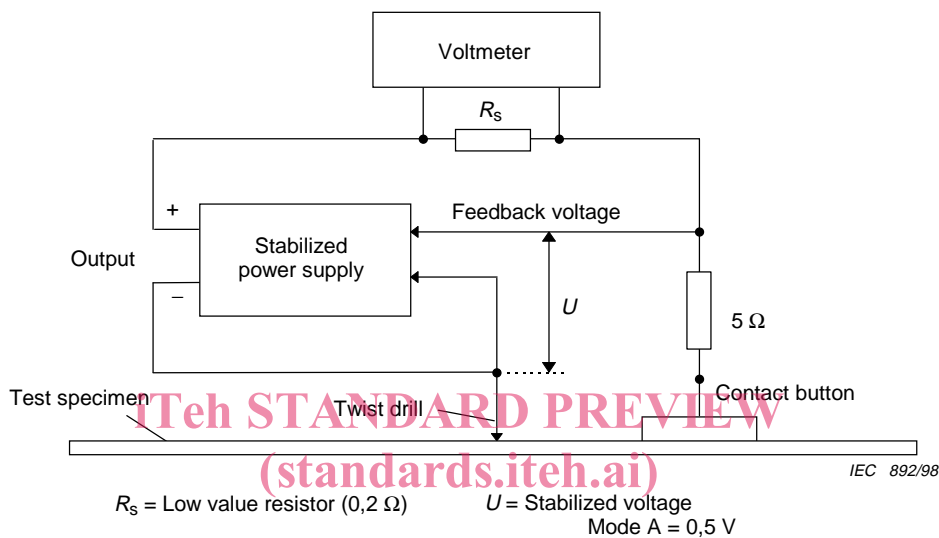
Page 11

4.3 Current measurement

Replace the second paragraph of this subclause by the following:

The electrical arrangements of the stabilizing circuit and current measurement system are shown in figures 2 and 3 for modes A and B respectively.

Replace figure 2 by the following two figures:



4.4 Mesure de la force appliquée

Remplacer le titre de ce paragraphe par le nouveau titre suivant:

Détermination de la force appliquée

Remplacer dans le texte de ce paragraphe «mesurée» par «déterminée».

5 Etalonnage

Remplacer le titre de cet article par le nouveau titre suivant:

Calibrage

Remplacer, à la première ligne de cet article, «L'étalonnage» par «Le calibrage».

Page 12

7 Evaluation de la résistance d'isolement superficiel

Ajouter, à la fin du point a), la note suivante:

NOTE – Si cinq mesures sont effectuées sur chaque face, la valeur C est le coefficient de la résistance d'isolement superficiel d'une face, qui représente la moyenne des deux faces du produit.

Ajouter, à la page 14, à la fin de la note, le nouveau texte suivant:

[IEC 60404-11:1991/AMD1:1998](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/42f77e51-22f5-45d0-af71-c6723cac959e/iec-60404-11-1991-amd1-1998)

Le système de régulation utilisé dans le mode B permet une résistance de contact entre le foret pour le passage du courant et le substrat, allant jusqu'à environ 1,5 Ω . Il convient que le système de régulation soit capable de maintenir une tension d'alimentation, entre les électrodes et le substrat, de 250 mV dans ces conditions.

4.4 Measurement of applied force

Replace the title of this subclause by the following new title:

Determination of applied force

Replace, in the text of this subclause, the word "measured" by "determined".

5 Calibration

The correction applies to the French text only.

Page 13

7 Evaluation of surface insulation resistance

Add, at the end of item a), the following note:

NOTE – If five measurements are taken from each surface, the value C is the coefficient of the surface insulation resistance of one surface, which represents the mean of the two surfaces of the product.

Add, on page 15, at the end of the note, the following new text:

The feedback system used in mode B allows a contact resistance, between the current return drill and the substrate, of up to about 1,5 Ω . The feedback system should be capable of maintaining a supply voltage, between the electrodes and the substrate, of 250 mV under these conditions.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/42f77c51-22f5-45d0-af71-c6723cac959e/iec-60404-11-1991-amd1-1998>

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60404-11:1991/AMD1:1998](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/42f77c51-22f5-45d0-af71-c6723cac959e/iec-60404-11-1991-amd1-1998)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/42f77c51-22f5-45d0-af71-c6723cac959e/iec-60404-11-1991-amd1-1998>

ISBN 2-8318-4450-9



9 782831 844503

ICS 17.220.01; 29.030
